

國立交通大學

光電工程學系 顯示科技研究所

碩士論文

複晶矽薄膜電晶體之晶粒結構與光漏電
之分析

Grain Size Effect and the Photo Leakage
Current of Poly-Si TFTs

研究生：魏全生

指導教授：冉曉雯 博士

中華民國九十五年六月

複晶矽薄膜電晶體之晶粒結構與光漏電之分析

Grain Size Effect and the Photo Leakage Current of Poly-Si

TFTs

研究生：魏全生

Student: Chung-Sheng Wei

指導教授：冉曉雯 博士

Advisor: Dr. Hsiao-Wen Zan

國立交通大學

光電工程學系 顯示科技研究所

碩士論文



A Thesis

Submitted to Department of Photonics

Institute of Display

College of Electrical Engineering and Computer Science

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master

in

Electro-Optical Engineering

June 2006

Hsinchu, Tawian, Republic of China

中華民國九十五年六月